



JKA設備・機器のご案内

2020年度に公益財団法人JKAの補助を受け導入した機器をご紹介します。

名称：EDS 付き低真空走査電子顕微鏡

メーカー：日本電子株式会社

型式：JSM-IT500LA(LaB6 仕様)

用途：材料に電子を照射して、高倍率の画像と元素情報を得る装置です。高倍率で観察しながら、ピンポイントでの元素分析が可能で、ものの出来栄確認や不良、異物の分析を行うことができます。

また、今回の装置は高倍率での面粗さなどの表面解析も可能です。



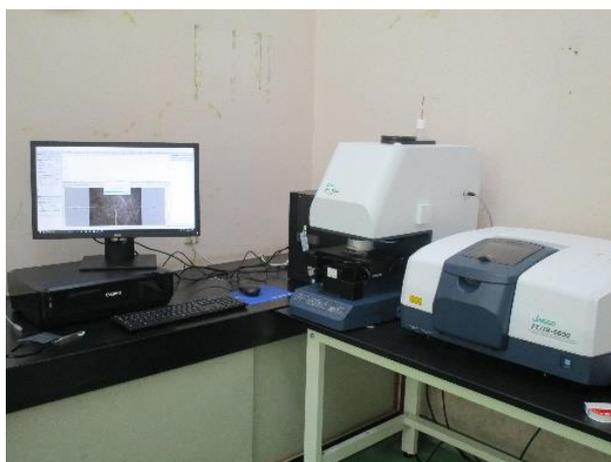
平成29年度公益財団法人JKA補助導入機器

名称：赤外顕微鏡付きフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）

メーカー：日本分光株式会社

型式：FT/IR6600（フーリエ変換赤外分光光度計）
IRT-5200（赤外顕微鏡）

用途：材料に赤外線を照射して、分子構造や官能基の情報を得ることができ、プラスチックや有機物の構造を推定する装置です。また、赤外顕微鏡を用いることで、材料の部位によって組成の違いを調べたり、材料中の異物を検査することができます。



名称：レーザー計測システム用オプションユニット

メーカー：レニショー株式会社

型式：レーザー計測システム（XL-80）
専用の角度、真直度、直角度、平面度測定ユニット

用途：レーザー計測システムとは、レーザー光を用いて非接触方式で、工作機械や三次元測定機など精度が要求される機械やシステムの精度評価を行う機器です。（レーザー計測システム本体(レニショー株式会社製XL-80)は平成27年度に導入済み）レーザー計測システムの位置決め精度検査に加え、当ユニットを組み合わせることで、他の精度検査（角度、真直度、直角度、平面度）も可能です。



平成26年度公益財団法人JK Aの補助導入機器

名称：蛍光X線分析装置

メーカー：株式会社島津製作所

型式：EDX-8000

用途：材料にX線を照射して発生する
蛍光X線から、材料に含まれる
元素の種類や量を分析する装置
です。原材料の組成分析や不純
物分析等にお使いいただけます。



平成25年度以前の導入機器

設備名	製造会社	型式	導入年度
CAD・CAM・CAEシステム	PTC 社	Creo(1B Pro/E wildfire)	H21
CADデータ修正・変換システム	(株)エリジオン	CADdoctor	H21
ラピッドプロトタイピング装置	Stratasys,Inc.	Dimension BST 1200es	H21
非接触三次元形状測定機	コニカミノルタセンシ ング(株)	VIVID 9i	H21
熱流体解析システム	(株)ソフトウェアクレイ ドル	SCRYU/Tetra	H23